**Шиколенко Юрий Леонидович. Развитие методов сканирующей зондовой микроскопии для диагностики электрофизических параметров элементов хранения энергонезависимой памяти: диссертация ... кандидата Технических наук: 05.27.01 / Шиколенко Юрий Леонидович;[Место защиты: Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники].- Москва, 2016.- 179 с.**